

## 第 47 回 信頼性・保全性シンポジウム 展示企業の出展内容

<b>出展企業</b>	丸文株式会社		
<b>E-メール</b>	takayuki_ueno@marubun.co.jp		
<b>TEL</b>	03-3639-9823	<b>担当者</b>	植野 崇之



### ロックイン発熱解析装置: ELITE

高感度赤外カメラとロックイン技術を組み合わせ、半導体・電子部品・実装基板の不良部位の場所特定を非破壊で行います。



- ・赤外線強度データと位相データで不良部位のXYZ位置情報特定が可能。
- ・10kV対応ロックイン電源にて大電力パワーデバイス/モジュールの不良解析に対応可能。
- ・カメラVer UP(フレームレート向上など)により、検出感度が3倍以上に改善。
- ・新型ソフトウェアSierraをリリースし、従来からの特長である高い操作性がさらに向上。
- ・加熱ステージ(サーマルチャック)など多種多様なオプションをご用意。



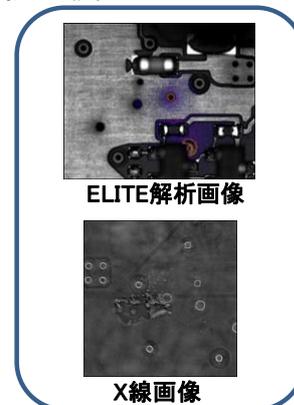
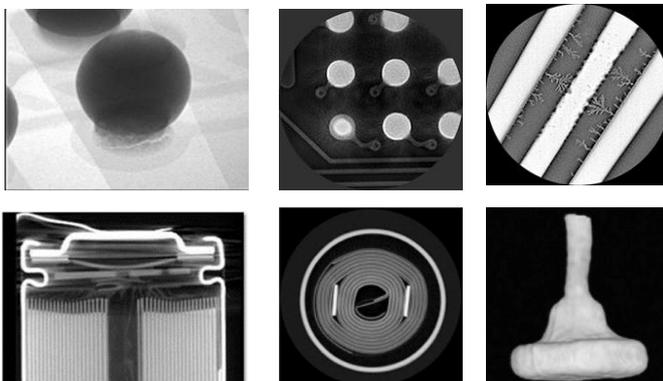
	7.2uW(DC)相当	3.6uW(DC)相当	1.8uW(DC)相当	
従来モデル				30 min
最新モデル				10 min

### UHS 慧 ユニハイトシステム

#### 新型X線CT装置

解析業務にフォーカスし、透視からCTまで高品質、高解像度な画像を得られる汎用性の高い最新システム。

- ・新型プラットフォーム+FPD+新画像処理の組み合わせにより、X線透視観察が格段に向上。
- ・高拡大から広視野(ワイヤー接合部の観察からLサイズ基板の観察)まで対応可能。
- ・新型インターフェース採用により、操作性が向上。短時間で誰にでも簡単にCT撮影が可能。



※その他、取扱い解析・検査における装置取扱いがございますので、お問い合わせください。



<http://www.marubun.co.jp/>